

**DF30PC3M****30V 30A****特長**

- SMD
- 超低  $V_F=0.4V$
- 小型大電流容量

**用途**

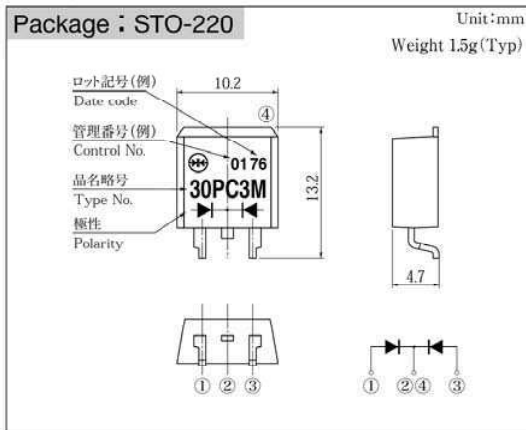
- バッテリー逆接防止
- DC出力OR用
- DC/DCコンバータ
- 携帯電話、パソコン

**Feature**

- SMD
- Ultra-Low  $V_F=0.4V$
- High Io Rating・Small-PKG

**Main Use**

- Reverse connect protection for DC power source
- DC OR-output
- DC/DC Converter
- Mobile phone, PC

**■外観図 OUTLINE**

外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

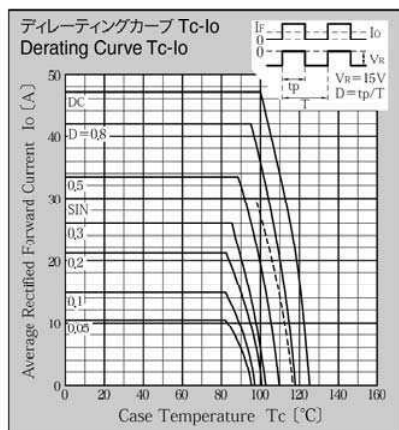
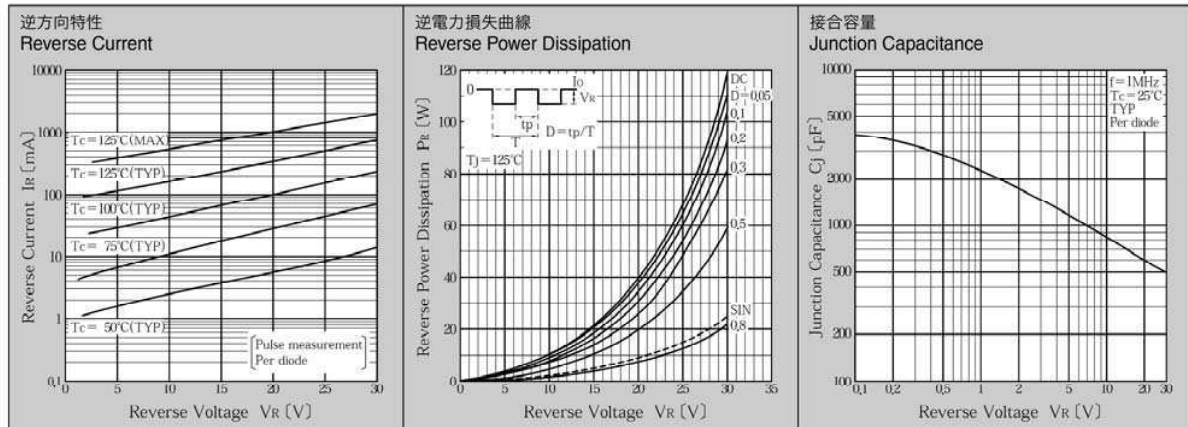
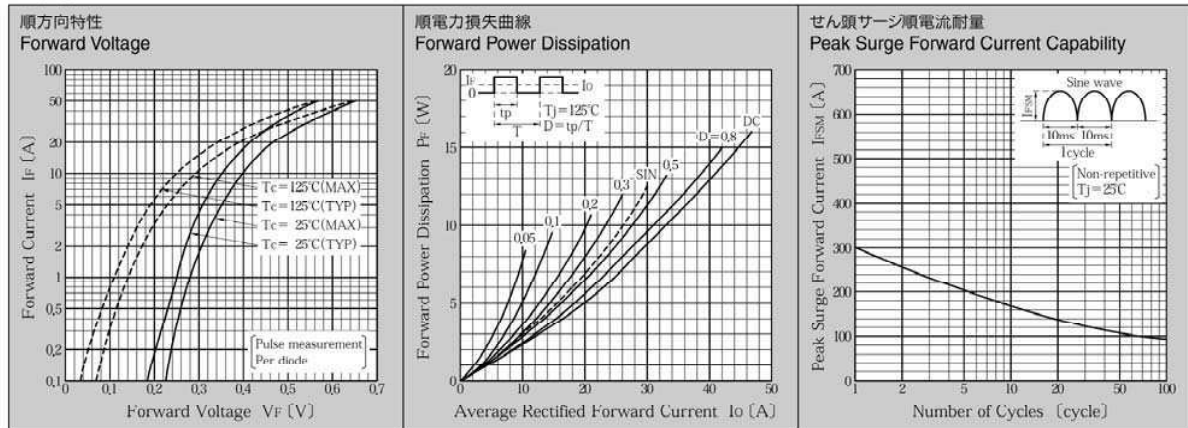
**■定格表 RATINGS****●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合  $T_c = 25^\circ C$ )**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	DF30PC3M	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	$T_{stg}$			-55~125	$^\circ C$
接合部温度 Operation Junction Temperature	$T_j$			125	$^\circ C$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	$V_{RM}$			30	V
繰り返しせん頭サージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Reverse Voltage	$V_{RRSM}$	パルス幅0.5ms, duty 1/40 Pulse width 0.5ms, duty 1/40		35	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	$I_o$	50Hz正弦波, 抵抗負荷, 1素子当りの出力電流平均値 $I_o/2$ , $T_c = 97^\circ C$ 50Hz sine wave, Resistance load, Per diode $I_o/2$ , $T_c = 97^\circ C$		30	A
せん頭リージ順電流 Peak Surge Forward Current	$I_{FSM}$	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ C$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 25^\circ C$		300	A

**●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合  $T_c = 25^\circ C$ )**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Per diode	DF30PC3M	単位 Unit
順電圧 Forward Voltage	$V_F$	$I_F = 10 A$ , パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 0.40	MAX 0.40	V
逆電流 Reverse Current	$I_R$	$V_R = V_{RM}$ , パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 50	MAX 50	mA
接合容量 Junction Capacitance	$C_j$	$f = 1 MHz$ , $V_R = 10 V$ , 1素子当りの規格値 Per diode	TYP 840	TYP 840	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	$\theta_{jc}$	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 1.6	MAX 1.6	$^\circ C/W$

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



\* Sine waveは50Hzで測定しています。  
 \* 50Hz sine wave is used for measurements.  
 \* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っており、Typicalは統計的な実力を表しています。  
 \* Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.